

Métrologie 2001



October 2001
Saint-Louis (Alsace), France

■ Presentation

The *International Metrology Congress* is organized every two years by the *Collège Métrologie* of the *Mouvement Français pour la Qualité*. The aims of the Congress are:

- to highlight new techniques of measurement and calibration that have been or are being developed; and
- to present the evolution of metrology and the implications for industry, the environment, the economy and quality, at national and international levels.

The Congress is a meeting place for the exchange of information, ideas and experience through oral presentations, poster sessions, an exhibition of metrological equipment and technical visits to industry.

It will attract over 600 people from 30 different countries, and from every circle concerned with metrology and measurement:

- metrologists from industry;
- metrologists from calibration laboratories;
- manufacturers and users of measuring instruments;
- quality managers; and
- teachers and researchers.

Métrologie 2001 is organized under the aegis of the *Bureau National de Métrologie* (BNM) and with the scientific support of the *National Physical Laboratory* (NPL).

■ Topics

The control of measurement and testing is an essential condition to ensure the quality of products. *Métrologie 2001* will address the following themes to meet these needs:

- measurement uncertainties;
- comparisons;
- capability of measurement facilities;
- measuring instruments;
- traceability, calibration and verification;
- measurement and testing procedures;
- control of measurement and analysis process;
- organization of the metrology function;
- standardization in the field of metrology;
- legal metrology;
- training and qualification of people; and
- economic aspects of metrology.

Authors have the possibility of developing those topics either in a general way or by applying them to a specific field:

- length;
- mass, force, pressure, acceleration;
- electricity, magnetism (including electromagnetic compatibility);
- time, frequency;
- temperature, humidity;
- flow;
- optical measurements;
- radiometry, photometry;
- ionizing radiations;
- chemistry, chemical analysis;
- environment, pollution;
- agricultural industry, œnology; and
- biotechnologies and medical applications.

■ Presentation of papers

The selection of papers will be made by a Scientific and Technical Committee. The Committee will choose the mode of presentation according to the subject: oral presentations, posters or round tables.

Authors will be able to present their papers either in French or English and simultaneous translation will be provided.

■ Exhibition

An exhibition of metrological equipment will be located at the same venue as the Congress from Monday, October 22 (16:00) through Thursday, October 25 (12:00). Registration forms and conditions will be sent out on request (see Organizing Committee contact details below).

ORGANIZING COMMITTEE

President

Patrick LEBLOIS - MECASEM Métrologie - Besançon

Vice-Presidents

Pierre Barbier - Collège Métrologie

Patrick REPOSEUR - COFRAC - Paris

Secretariat *Métrologie 2001*

Sandrine GAZAL

Maison de l'Entreprise, 429, rue de l'Industrie,
34966 Montpellier Cedex 2, France

Tel: 33 (0)4 67 06 20 36

Fax: 33 (0)4 67 06 20 35

E-mail: sandrine.gazal@wanadoo.fr

Web: www.metrologie2001.com

■ Présentation

Le *Congrès International de Métrologie* est organisé, tous les deux ans, par le *Collège Métrologie du Mouvement Français pour la Qualité*. Ses objectifs sont:

- de faire le point sur les techniques d'étalonnage et de mesure originales, développées ou en cours de développement; et
- de présenter les évolutions de la métrologie et ses implications dans l'industrie, l'environnement, l'économie et la qualité, au niveau national et international.

Le Congrès est un carrefour d'échange d'informations, d'idées et d'expériences autour de conférences, orales et affichées, d'une exposition de matériel métrologique et de visites techniques d'entreprises.

Il rassemble désormais plus de 600 participants, de 30 pays différents et de tous les milieux concernés par la métrologie et la mesure:

- des métrologues de l'industrie;
- des métrologues des laboratoires d'étalonnage;
- des constructeurs et utilisateurs d'appareils de mesure;
- des responsables qualité; et
- des enseignants et chercheurs.

Métrologie 2001 est organisé avec le concours du *Bureau National de Métrologie* (BNM), et la participation scientifique du *National Physical Laboratory* (NPL).

■ Thèmes

La maîtrise des mesures et des essais est une condition indispensable pour garantir la qualité des produits. Afin de répondre à ces préoccupations *Métrologie 2001* abordera les thèmes suivants:

- incertitudes de mesure;
- comparaisons;
- capacité des moyens de mesure;
- instruments de mesure;
- traçabilité, étalonnage et vérification;
- procédés de mesure et d'essais;
- maîtrise des processus de mesure et d'analyse;
- organisation de la fonction métrologique;
- normalisation en métrologie;
- métrologie légale;
- formation, qualification des personnels; et
- aspects économiques de la métrologie.

Les conférenciers ont la possibilité de développer ces thèmes soit d'une manière générale, soit en les appliquant à des domaines spécifiques:

- dimensionnel;
- masse, force, pression, accélération;
- électricité, magnétisme (y compris compatibilité électromagnétique);

- temps, fréquence;
- température, hygrométrie;
- débits;
- mesures optiques;
- radiométrie, photométrie;
- rayonnements ionisants;
- chimie, analyses chimiques;
- environnement, pollution;
- agro-alimentaire, œnologie; et
- biotechnologies et applications médicales.

■ Présentation des conférences

La sélection des conférences sera réalisée par un Comité Scientifique et Technique. Ce comité choisira le mode de présentation en fonction des sujets: conférences orales, conférences affichées ou tables rondes.

Les conférenciers pourront présenter leur sujet soit en français, soit en anglais. Une traduction simultanée sera assurée.

■ Exposition

Une exposition de matériels métrologiques se déroulera sur le lieu du congrès du lundi 22 octobre à 16h au jeudi 25 octobre à 12h. Les modalités de participation seront adressées sur demande (voir coordonnées du Comité d'Organisation ci-contre).

